ArFレーザーを用いたレーザーアブレーション法による 酸素雰囲気中におけるダイヤモンド薄膜のホモ成長

吉武, 剛

九州大学大学院総合理工学研究科量子プロセス理工学専攻

西山, 貴史 九州大学大学院総合理工学研究科量子プロセス理工学専攻

原, 武嗣 九州大学大学院総合理工学研究科量子プロセス理工学専攻

永山, 邦仁

九州大学大学院総合理工学研究科量子プロセス理工学専攻

https://doi.org/10.15017/16591

出版情報:九州大学大学院総合理工学報告.22(2),pp.173-176,2000-09.九州大学大学院総合理工学府 バージョン: 権利関係:

ArF レーザーを用いたレーザーアブレーション法 による酸素雰囲気中における ダイヤモンド薄膜のホモ成長

吉 武 剛* ·西 山 貴 史** 原 武 嗣***·永 山 邦 位* (平成12年6月5日 受理)

Homo-growth of diamond thin films in an oxygen atmosphere by pulsed laser deposition using an ArF excimer laser

Tsuyoshi YOSHITAKE, Takashi NISHIYAMA, Takeshi HARA and Kunihito NAGAYAMA

Diamond thin films were grown on diamond (100) substrates in an oxygen atmosphere by pulsed laser deposition (PLD) using an ArF excimer laser. The optimum oxygen atmosphere of 5×10^{-1} Torr can etch the sp² bonding fractions preferentially. At a substrate temperature less than 400°C, amorphous carbon thin films, which showed typical G and D peaks in Raman spectrum, were grown. At the range between 450°C and 500°C, a lot of diamond crystals with $1 \sim 10 \mu m$ diameters were generated in amorphous carbon. At the range between 550°C and 650°C, single phase diamond films consisting of diamond crystal with $1 \sim 2 \mu m$ diameters were grown. The results demonstrated that the oxygen pressure and the substrate temperature are determinant parameters in the growth of diamond by PLD.

1. はじめに

ダイヤモンドおよびダイヤモンドライクカーボン (DLC)は、極めて硬い、高い化学的安定性、耐摩耗 性、優れた光学透過性などの特長を有することから、 さまざまな産業分野への応用が期待されている。ダイ ヤモンドは sp³ 結合からなる結晶、DLC は sp³ 結合 と sp² 結合が混在する非晶質であるが、これらの優れ た性質は sp³ 結合に起因する。ダイヤモンドおよびダ イヤモンド状炭素(DLC)はそれぞれ高温高圧相、非 平衡相であり旧来の方法では作製困難であったが、近 年プラズマ CVD 法¹¹などの化学気相成長法を用いて 盛んに研究され、比較的容易に作製できるようになっ た.物理気相成長法でもスパッタリング法²¹やイオン ビーム蒸着法³¹などで報告があるがその数は少ない. 特にダイヤモンド薄膜に関してはその作製が極めて困 難であると考えられほとんど研究されていない.

物理気相成長法の中でレーザーアブレーション法は

(*工学研究院航空宇宙工学部門

近年,酸化物¹¹や化合物半導体⁵¹などの様々な材料に適 用され、高品質な膜が低温で得られることで注目を集 めている.この作製法のユニークな特徴としては、① 高エネルギー粒子付着であるために他の作製法に比べ て低温成長が可能である, ②準安定相や非平衡相が生 成しやすい、③高純度膜の作成が可能、④ターゲット からの組成ずれが少ない、 ⑤装置が単純、 などが挙げ られる. このうち, ①, ②, ③の特徴はダイヤモンド と DLC の作製に極めて有効であると考えられるが、 その試みはまだ少ない.特にダイヤモンド薄膜に関し ては数件しかない.ダイヤモンドの微結晶を含むアモ ルファスカーボン薄膜が450℃付近の低い基板温度で 得られることが1995年に M.C. Polo ら[®]のよって報告 され注目を集めたが、他のグループでは再現できない などの原因でその後進展していない. これはダイヤモ ンドが成長するための条件がそれぞれの研究グループ の実験装置に強く依存することによる. 1999年に吉本 ら"は酸素雰囲気中でサファイヤ基板を用いて膜作製 を行い,アモルファスカーボン膜中に直径数µm のダ イヤモンド結晶がヘテロエピタキシャル成長すること を報告し注目を集めている.しかし、ダイヤモンドが 成長するためのキーファクターはよくわかっておらず 系統的で詳細な膜成長条件の解明が必要である.

^{*}量子プロセス理工学専攻(総合理工学研究院融合創 造理工学部門)

^{**}量子プロセス理工学専攻修士課程(現 三井ハイ テック株式会社)

^{**}量子プロセス理工学専攻修士課程

我々は今までの研究で、PLD 法のカーボン薄膜の 成長における主な膜作製制御パラメーター、具体的に はレーザー波長⁸⁾,基板温度⁸⁾,雰囲気ガス(酸素,水 素)⁹⁾,ターゲット材料¹⁰¹¹¹などの効果を系統的に調べ た.これにより、酸素・水素雰囲気ガスの PLD 法に おけるグラファイト成分エッチングプロセスを明らか にした⁹⁾.さらに、アブレーションプロセスを発光ス ペクトル分析により調べ¹²⁾,生成膜の評価結果と対比 させることで、DLC 薄膜の膜成長モデルを提案した¹³⁾.

ダイヤモンド薄膜の生成は、核発生と膜成長からな る. 化学気相成長法では, 膜成長条件はすでに明らか にされ,現在はヘテロ成長を実現するために核発生条 件が盛んに研究されている.一方、レーザーアブレー ション法ではまだどちらもわかっていない.本研究で はまず膜成長の条件を明らかにすることを目的として, 基板にダイヤモンドを用いて膜作製を行った. 今まで の実験結果をもとに、レーザーには基板到達粒子が最 も単原子化して励起状態の高くなる ArF エキシマ レーザーを、雰囲気ガスにはグラファイト成分のエッ チング効果が極めて高い酸素を用い、ターゲットには 膜中に水素が残留しないためにグラファイトを用いた. 基板温度は、DLC 薄膜作製では高エネルギーの基板 到達粒子が膜中をマイグレートしないために出来るだ け低く設定する¹³⁾のに対して、ダイヤモンド薄膜作製 では基板到達粒子が直ちに結晶成長のために基板表面 を移動できるように400℃以上に上昇させた.多結晶 ではあるがダイヤモンドをホモ成長できたので報告す る.本報告は、ホモ成長ではあるがダイヤモンドの単 相膜を成長させたレーザーアブレーション法で最初の 報告である.

2. 実験方法

薄膜作製に用いた実験装置を Fig. 1 に示す. ArF



Fig. 1 The experimental schematic for film deposition.

エキシマレーザー ($\lambda = 193$ nm)を集光して入射角 45°でターゲット表面に約2mmで照射し,25mm離れて 対向するダイヤモンド(100)基板に膜作製を行った. 基板温度は400~650℃範囲で変化させ,繰り返し周波 数は10Hz,フルーエンスは5J/cm²とした. 膜作製前 に基板をアセトンで超音波洗浄し,その後チャンバー 内で400℃以上で約2時間のベーキングを行った. ターゲットにはグラファイト(99.99%)を用いた. チャンバー内は油拡散ポンプを用いて10⁻⁶Torr 以下 まで排気し,酸素を流入することで10⁻³~1 Torr の 範囲の圧力下で膜作製を行った.生成膜の膜表面を走 査型電子顕微鏡(SEM)を用いて,膜構造をラマン分 光測定装置を用いて調べた.

実験結果および考察

今まで行ってきた DLC 薄膜作製の研究で、雰囲気 ガスに酸素を用いることによって, グラファイト成分 すなわち sp² 結合成分を選択的に除去できることを報 告した?). この選択なエッチング効果は、酸素がグラ ファイト成分すなわち sp² 結合成分を sp³ 結合成分に 比べて高い割合でエッチングすることにより実現され る.酸素圧力を適切な値に設定すれば sp³結合成分の 高い割合の膜を基板に堆積可能である.本研究ではま ず最初に, その条件を調べた. 酸素圧力が 10⁻¹ Torr 以上では、酸素のエッチング効果が強すぎて sp² 結合、 sp³結合成分ともにエッチングされてしまい膜は全く 堆積しなかった.一方, 10⁻³ Torr 付近の圧力では, 酸素のグラファイト成分のエッチング効果が不十分の ために, どの基板温度においてもダイヤモンドの生成 に関わらずアモルファスカーボンが残留した. アモル ファスカーボンを出来るだけ残留させないために、膜 が堆積しなくなる直前の5×10⁻² Torr にてダイヤモ



Fig. 2 SEM image of the film deposited at a substrate temperature of 450 °C and oxygen pressure of 5×10^{-2} Torr

-175 -



Fig. 3 (a) SEM image of the film deposited at the substrate temperature of 450° and oxygen pressure of 5×10^{-2} Torr, (b) Raman spectrum of the film surrounding the particles, (c) Raman spectrum of the isolated particle on the film

ンド薄膜の作製を行った.この圧力時の膜堆積速度は, 約5×10nm/min であった.

基板温度が400℃では、ラマンスペクトルでGピー クとDピークを示す典型的なアモルファスカーボンが 生成し、ダイヤモンドは成長しなかった.

基板温度が450~500℃では, **Fig. 2** に示すように, アモルファスカーボン中に直径 1 ~10μm の粒が観測 された. **Fig. 3** に示すように粒と膜のそれぞれの領域 におけるラマンスペクトル測定から, 膜はGピークと Dピークを示すことからアモルファスカーボン, 粒は 1332cm⁻¹ に鋭いピークを示すことからダイヤモンド であることがわかった.

基板温度が550~650℃では,**Fig.4**(**a**) に示すよう に生成膜は直径 1~2 μ m 前後の正方形の結晶粒から なることがわかった. ラマンスペクトル測定からこれ らの結晶粒は **Fig.4**(**b**) に示すように1332cm⁻¹にピー クを示すことからダイヤモンドであることがわかった. 結晶粒の膜上面から見たみた形がどれもほぼ正方形で あることから,膜の深さ方向に(100)配向していると 考えられる.したがって、ダイヤモンド(100)基板に 対して深さ方向のみの一軸配向エピタキシャル成長膜 になっていると思われる.

高温高圧相であるダイヤモンドが生成するためには, 基板到達粒子がエネルギーを失う前に直ちに基板表面 を移動する必要がある.基板表面での移動性は主に基 板到達粒子のエネルギー,基板材料,基板温度によっ て決まる.基板温度は高いほど移動性は高まる.基板 温度に対する膜構造の変化より,ダイヤモンドの成長 を以下のように考察できる.基板温度が550~650℃で は,基板到達粒子が高いエネルギー状態を保ったまま 十分に基板表面を移動できるのでダイヤモンドが成長 する.450~550℃では,基板到達粒子の表面移動性が 不十分なために部分的しかダイヤモンドが成長しない. 400℃以下では,表面移動性が全く足りないために非 晶質のアモルファスカーボンが生成する.この場合基 板到達粒子のエネルギーは結晶成長に使われることな く,基板上にて熱として失われると考えられる.

さらに、ダイヤモンドの成長には酸素のエッチング



 $1 \mu m$

Fig. 4 (a) SEM image and (b) Raman spectrum of the film deposited At a substrate temperature of 550°C and oxygen pressure of 5×10^{-2} Torr

効果を含めたアブレーションプロセスが強く寄与して いる.実際に膜作製時のアブレーションプラズマの肉 眼観察にて、ダイヤモンドが成長するときとしないと きではプラズマの色に明白な違いが見られた.今後、 発光スペクトル分析などを行い、膜堆積プロセスとダ イヤモンド成長との関連を調べる予定である.

4. 結 論

ダイヤモンド薄膜生成のためには、核発生と膜成長 の条件をそれぞれ明らかにする必要がある.本研究で はまず膜成長条件を明らかにするために、ダイヤモン ド基板上にホモ成長を行った.多結晶ではあるがダイ ヤモンドの単相膜を成長することができ、PLD 法に おける大まかなダイアモンドの成長条件を明らかにし た.

謝 辞

本研究を行うにあたり,ArF エキシマレーザーは 九州大学電離気体実験施設のものを,ラマンスペクト ルの測定には九州大学中央分析センターのレーザーラ マン分光光度計を,膜表面観察には九州大学大学院総 合理工学研究府旧材料開発専攻の SEM を使用させて いただいた.

本研究の一部は(凹)日本板硝子材料工学助成会の援助 によりなされたものである.

参考文献

- M. Kamo, Y. Sato, S. Matsumoto, and N. Setaka, J. Cryst. Growth, 62, 642 (1983).
- 2) E. Mounier, F. Bertin, M. Adamik, Y. Pauleau, and P.B. Barna, *Diamond Relat. Mater.*, **5**, 1509 (1996).
- H. Hofsass, H. Binder, T. Klumpp, and E. Recknagel, Diamond Relat. Mater., 3, 137 (1994).
- N. Watanabe, N. Takahashi and K. Tsushima, Mater. Chem. Phys., 54, 173 (1998).
- 5) T. Yoshitake, T. Nagamoto and K. Nagayama, *Mater. Sci. Eng. B*, **72**, 124, 15 (2000).
- M.C. Polo, J. Cifre, G. Sanchez, R. Aguiar, M. Varela and J. Esteve, *Diamond. Relat. Mater.*, 5, 780 (1999).
- 7) M. Yoshimoto, K. Yoshida, H. Maruta, Y. Hishitani, H. Koinuma, S. Nishio, M. Kakihana and T. Tachibana, *Nature*, **399**, 340 (1999).
- 8) T. Yoshitake, T. Nishiyama, H. Aoki, K. Suizu, K. Takahashi, and K. Nagayama, *Diamond. Relat. Mater.*, **8**, 463 (1999).
- 9) T. Yoshitake, T. Nishiyama, and K. Nagayama, *Diamond Related. Mater.*, **9**, 689 (2000).
- 10) T. Yoshitake, T. Nishiyama and K. Nagayama, J. Mater. Sci. Lett, 19, 489 (2000).
- T. Yoshitake, T. Nishiyama and K. Nagayama, Transactions of the Materials Research Society of Japan, 25, 321 (2000).
- 12) 吉武剛,西山貴史,青木肇,水津光司,高橋厚史,永山 邦仁,電気学会論文誌,**A119**,1147,(1999).
- 13) T. Yoshitake, T. Nishiyama, H. Aoki, K. Suizu, K. Takahashi, and K. Nagayama, *Appl. Surf. Sci.*, 141, 129 (1999).